

D4SBL20U

200V 4A

特長

- ・薄型 SIP パッケージ
- ・LLD ブリッジ
- ・高速応答(Trr が短い)

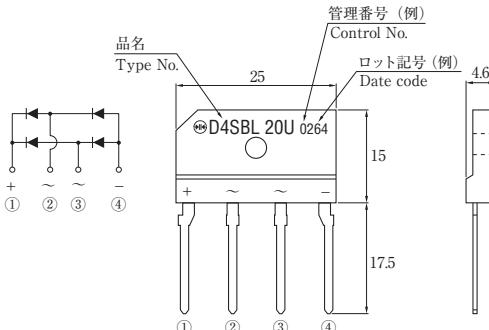
Feature

- ・Thin-SIP
- ・Super FRD-Bridge
- ・Quick-response Trr

■外観図 OUTLINE

Package : 3S

Unit : mm
Weight : 3.9g(typ.)



外形図については新電元 Web サイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of outline dimensions, refer to our web site or the Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection."

■定格表 RATINGS

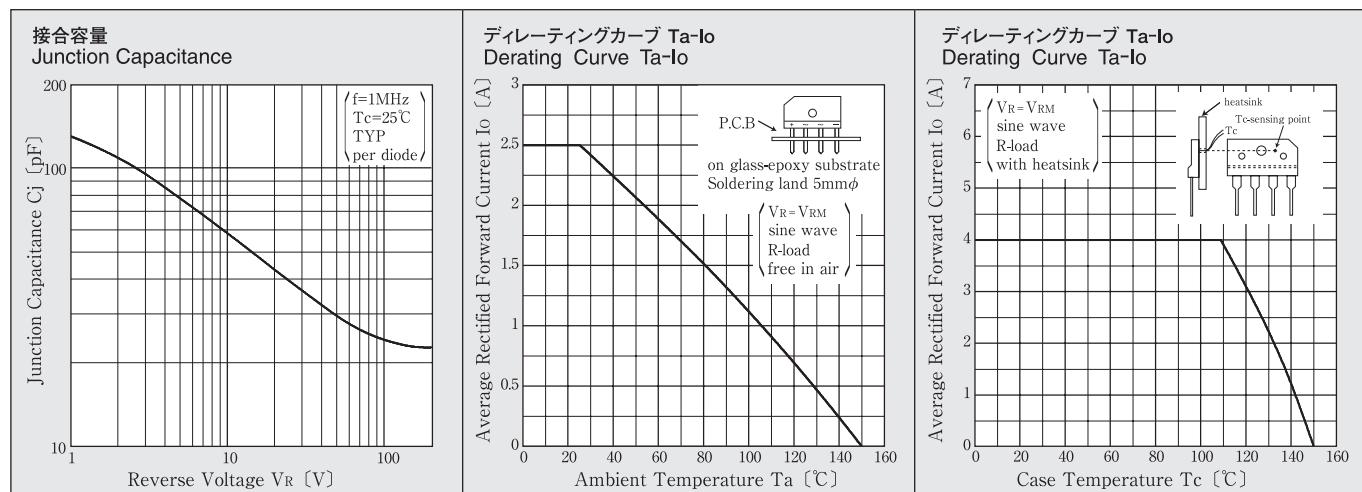
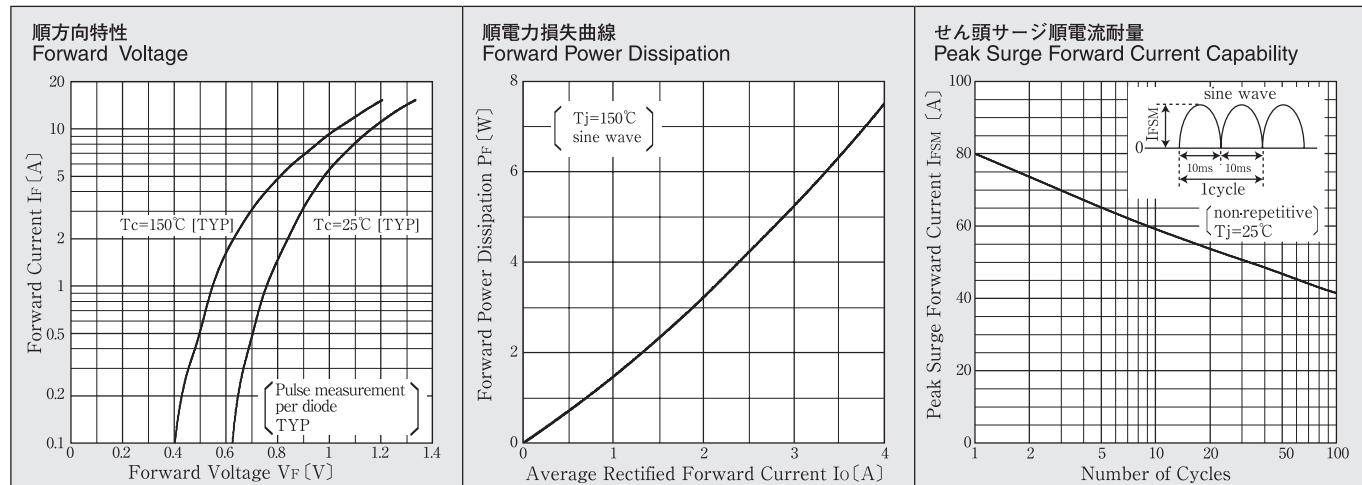
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	D4SBL20U	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM			200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フイン付き With heatsink Tc = 108°C フインなし Without heatsink Ta = 25°C	4 2.5	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し 1 サイクルせん頭値, TJ = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, TJ = 25°C		80	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	Vdis	一括端子・ケース間, AC 1 分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2	kV
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N·m) (Recommended torque : 0.5 N·m)		0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $TJ = 25^\circ\text{C}$ / unless otherwise specified)

順電圧 Forward Voltage	VF	IF=2A, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 0.98	V
逆電流 Reverse Current	IR	VR=VRM, バルス測定, 1 素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	IF=0.5A, IR=1A, 1 素子当たりの規格値 per diode	MAX 35	ns
熱抵抗 Thermal Resistance	θjc	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 5.5	°C/W
	θjl	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 6	
	θja	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 30	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- * Sine wave は 50Hz で測定しています。
- * 50Hz sine wave is used for measurements.
- * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っております。
- Typical は統計的な実力を表しています。
- * Semiconductor products generally have characteristic variation.
- Typical is a statistical average of the device's ability.